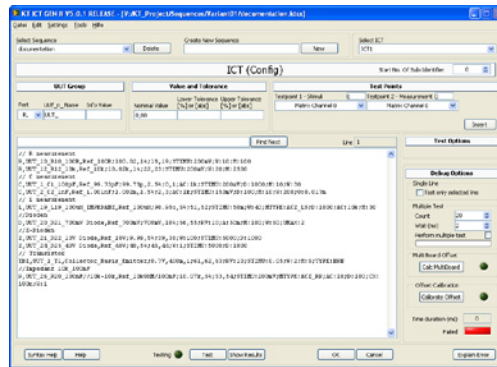


In-Circuit Testsystem KT-8500 Little LEON



Kurzbeschreibung:

In-Circuit Testsystem mit 128 - 256 Testpunkten. Kompaktes und preiswertes ICT-System innerhalb der KT-8500 LEON-Familie. Investitionssicherung durch Erweiterungsmöglichkeit auf über 2304 Testpunkte durch Ergänzung um weiteres 18 Slot-Chassis.

Highlights:

- ICT-System basierend auf offener PXI-Plattform
- Vermessung von passiven Bauelementen
- Guarding-Funktionalität
- Günstiger Einstiegspreis
- Skalierbarkeit, Erweiterungsmöglichkeit
- ICT-Software sofort lauffähig, ohne Programmierung
- Unterstützung für NI TestStand, NI LabVIEW, C++, VB

Details:

Das Testsystem KT-8500 Little LEON stellt eine äußerst kostengünstige Testlösung für Ihren In-Circuit Test dar. Es beinhaltet alle notwendigen Systemkomponenten, um eine Baugruppe mit 128 Testpunkten zu testen (256 optional). Folgende Systembestandteile sind enthalten:

5-Slot PXI-Chassis

Integrierter MXI-Controller (Anbindung an Windows PC)

Konrad ICT-Verstärker KT ICT-GEN II

National Instruments 16-Bit DAQ-Karte

National Instruments 128x4 Schaltmatrix

Terminal Blöcke zur Schaltmatrix und zur DAQ-Karte

Kabel-Kit zur 1:1 Verbindung an Testadapter (Pylon oder andere)

Das System zeichnet sich durch sehr geringen Platzbedarf und denselben, hohen Funktionsumfang aus, wie die größeren Systeme der Konrad Technologies LEON-Familie. Die Anzahl der verfügbaren Testpunkte beträgt bei dieser Lösung 128. Bei sich ändernden Testanforderungen kann das System durch Hinzufügung eines weiteren PXI-Chassis leicht erweitert werden, so dass bis zu 2304 Testpunkte mit dem System abgedeckt werden können.

Die beiden größeren Varianten, KT-8500 LEON und KT-8500 LEON ABex verfügen über mehr Slots zur Aufnahme von Instrumenten und Schaltmatrizen, bzw. über weitergehende Signalversaltungsmöglichkeiten.

Ein herausragendes Merkmal ist die Möglichkeit, Module für den Funktionstest zu integrieren, wie z.B:

Source Measurement Unit, Scope, HF-Suite, digitale Pattern I/Os, Boundary Scan, usw.

Die mitgelieferte Software ist ohne Programmierung sofort einsatzbereit. Die Windows-Applikation dient zur Konfiguration des ICT Programms mit Hilfe eines komfortablen Editors. Innerhalb derselben Applikation erfolgt die Programmausführung mit Pass/Fail Ausgabe. Für die Einbindung in eigene Applikationen liegen die Quelldateien als NI LabVIEW und C++ Quellen bei. Für die Anwender von NI TestStand liegt eine komplette Testschrittbibliothek dem Softwarepaket bei.

Zum Standardlieferungsumfang gehört folgende Software-Ausstattung:

KT-ICT:	Windows-Applikation zur Konfiguration und Ausführung des ICT-Programms ohne Programmierung Testschrittbibliothek zur Einbindung in NI TestStand VI-Bibliothek zur Verwendung in NI LabVIEW DLL zur Entwicklung eigener Testapplikationen in Visual C/C++, Visual Basic, usw.
---------	---

Optional erhältliche Software:

Router Solutions CAMCAD:	Automatische ICT-Programmerzeugung aus CAD-Daten der Leiterplatten
KT-OP:	Operator Interface zur Bedienung des Testsystems unter Produktionsbedingungen Unterstützung verschiedener Login-Ebenen, Benutzerverwaltung, Parameteranpassungen
KT-STAT:	Tool zur Betrachtung und Analyse von Ergebnisdaten, SPC-Analyse, z.B. Prozessfähigkeit
KT-PRS:	Papierlose Reparaturstation

Spezifikationen:

Generelle Architektur

5-Slot PXI chassis mit integrierter MXI-Express Schnittstelle

R, C, L, Impedanz, Diode, Zener Diode ICT-Messungen mit Guarding ¹

Schaltmatrix 128x4 (NI PXI-2532)

Stimuli: ±10V/10mA; ±10V/200mA; 5-50V/20mA

Test von bis zu 400 Komponenten / s ²

¹ Spulen und Impedanzmessung nur mit NI PXI-625x möglich. Kostengünstige Karte NI PXI-622x auf Frequenz von 10kHz begrenzt.

² R-Messung mit System-CPU: Intel® Core™2 Quad CPU Q6600 @ 2.4GHz

Test von Widerständen (DC)

Bereich	Stimulierung (Standard)	Fehler	# Leitungen
100mΩ bis 10Ω	0.1V	±2.5%	4
10Ω bis 100Ω	0.2V	±2.5%	2 oder 3 ¹
100Ω bis 100kΩ	0.2V	±1%	2 oder 3 ¹
100kΩ bis 1MΩ	0.2V	±1%	2 oder 3 ¹
1MΩ bis 10MΩ	1V	±2%	2 oder 3 ¹

¹ Guarded Messung

Test von Kondensatoren (AC)

Bereich	Stimulierung (Standard)	Fehler	Frequenz (Standard)	# Leitungen
10pF bis 100pF	0.2V	±5%	1kHz/10kHz	2 oder 3 ¹
100pF bis 10nF	0.2V	±2.5%	1kHz	2 oder 3 ¹
10nF bis 100nF	0.2V	±1%	1kHz	2 oder 3 ¹
100nF bis 30uF	0.2V	±1%	500Hz/1kHz	2 oder 3 ¹
30uF bis 100uF	0.2V	± 1%	20Hz	2 oder 3 ¹
100uF bis 3mF	0.2V	±2.0%	10Hz	2 oder 3 ¹
3mF bis 10mF	0.2V	±2.0%	2Hz	2 oder 3 ¹

¹ Guarded Messung

Test von Spulen (AC)

Bereich	Stimulierung (Standard)	Fehler	Frequenz (Standard)	# Leitungen
25uH bis 100uH	0.2V	±5% ³	10kHz/20kHz	2 oder 3 ¹
100uH bis 1mH	0.2V	±3%	1kHz	2 oder 3 ¹
1mH bis 100mH	0.2V	±3%	1kHz	2 oder 3 ¹

¹ Guarded Messung; ³ mit Offset

Test von Kurzschlüssen und Verbindungen		Z-Dioden- / Dioden-Test	Transistor-Test	Entladefunktion
Stimulierung	50mV bis 100mV	Spannung 5-50V / 0-10V	Messung von Basis/Emitter Diodenstrecken	max. 250mA
Schwellwert	1Ω to 1kΩ	Programmierbarer Strom 1uA - 20mA / 1uA - 100mA		

Spezifikationen sind gültig für Software-Version 5.10 und Hardware-Version 5.01

Automotive +++ Avionics +++ Semiconductors +++ Telecommunication +++ Medical +++ Industrial